# 昇華法による $Zn S_x Se_{t-x}$ 結晶の光学的性質

岸田 悟, 武田 文憲, 松浦 興一, 鶴見 一郎

(1980年5月31日受理)

Optical Properties of ZnS<sub>x</sub> Se<sub>1-x</sub> Crystals Grown by the Sublimation Method

Satoru Kishida, Fuminori Takeda, Koichi Matsuura and Ichiro Tsurumi

(Received May 31, 1980)

#### Abstract

Using the modified Piper method which is one of sublimation methods,  $\operatorname{ZnS}_x \operatorname{Se}_{l-x}$  crystals were grown with x=1, 0.2, 0.83 and 0.89. Photoluminescence spectra of ZnSe crystal samples (x=0) are reported. The as-grown ZnSe crystals have an emission band to be identified as SA emission. By firing in Zn vapor, emission bands with peak energies at 2.34 eV and 1.96 eV are induced. They may correspond to Cu-B and Cu-G emission bands in ZnS crystal. No emission band is found on the sample fired in Se vapor.

#### 1. はじめに

II一VI族化合物中比較的大きなバンドギャップを持つ ZnSe は、可視領域でのオプトエレクトロニクス材料と して有用であるが、その光学的及び電気的性質は、結晶 中に存在する不純物や真性格子欠陥の性質に強く依存す る。しかし、これらの結晶中に含まれる真性格子欠陥の 性質においてさえも不明な点が多い。

J. Schneider ら<sup>1)</sup> は、中性子照射あるいは Zn 処理した ZnS において  $F^+$ 中心一陰イオン空孔に電子が 1 個トラップされた中心一による ESR 信号 を 観測し、 ZnS 中に  $F^+$  中心が導入されていることを報告している。 さらに Y. Schno ら<sup>2)</sup> は、電子線照射した ZnS においても  $F^+$  中心による ESR 信号を 観測した。 K. Matsuuraら<sup>3,4)</sup> は、Zn 処理及び中性子照射した ZnS において、 $F^+$ 中心によると思われる光吸収帯が生じることを報告している。G. D. Watkins<sup>5,6)</sup> は、電子線照射した 1 タイプの 1 ZnSにおいて、1 V 中心一陽イオン空孔にホールが 1 個トラップされた中心一による ESR 信号を観測し、電子線照射により ZnSe 中に 1 マー中心

が導入されていることを報告している。 このように, ZnS 及び ZnSe では、それぞれ  $F^+$ 中心及び  $V^-$ 中心 の存在が確認されているが、ZnS の V 中心や ZnSe の  $\mathbf{F}^{\dagger}$  中心が生成されたという明確な報告はないように 思われる。また、F. Morehead ら<sup>7)</sup>は、種々の組成比 xを持つ  $Z_n$   $S_r$   $Se_{7-r}$  のエネルギーギャップと 可視領 域に観測される2つの発光帯のピークエネルギーが、組 成比 x の増加とともに増加することを報告している。 さらに ZnS で古くから 研究されている 発光中心 SA, Cu-B, Cu-G 等に対応する発光中心も, ZnSe に存 在することが明らかにされている<sup>8)</sup>。 そこで ZnS で生 じる  $F^+$ 中心による ESR 信号, $F^+$  光吸収帯及び発光 帯が、 $Zn S_x Se_{1-x}$ 結晶の組成比 x、とともにどのよう に変化するかを明らかにすることは、非常に興味深いよ うに思われる。このためには、種々の $ZnS_r$ Se<sub>1-r</sub>結晶 を作成する必要がある。今回, その中間報告として, 昇 華法により  $ZnS_x Se_{t-x}$  結晶の作成及び作応した x=0の ZnS, Se, , すなわち ZnSe のフォトルミネッセンス (以下PLと略す) について報告する。また、Zn 過剰及

び Se 過剰の欠陥を ZnSe 結晶に導入するため、Zn 蒸気中で熱処理を行なった。それらの試料における PL スペクトルについても報告する。用いた結晶成長法は、昇華法の一種である modified Piper 法である。この方法は、生成過程に蒸留が含まれるので、純度の高い結晶を得ることができる。このことは、上述のように、結晶中の真性格子欠陥を研究する上で、重要である。

## 2. 実 験

昇華法の一種である modified Piper 法により  ${\rm ZnS}_x \, {\rm Se}_{I-x}$  単結晶を作成した。 使用した装置及びその 温度分布の概略図を Fig. 1 に示す。 焼結体を作成する ため,純度 5 Nの  ${\rm ZnS}$  及び  ${\rm ZnSe}$  粉末を  ${\rm H}_2$  ガス,  ${\rm H}_2$   ${\rm S}$  ガス中あるいは,真 空 中で 処 理し,それらを組成比 ${\rm y}$ 

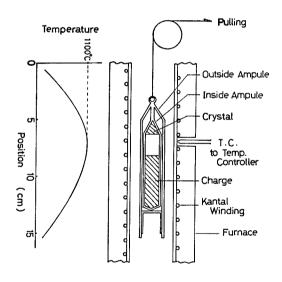


Fig. 1 Cross section and temperature profile of our furnace used for crystal growth.

で混合し、約1000℃に23時間保った。これらの組成比 $\nu$ なる焼結体を用いて  $0.5\sim1.0$ cm/day の引張り速度で、電気炉内の最高温度約 $1000\sim1200$ ℃のもとで成長させた。

作成した結晶について X線回折の実験を行ない, 作成した結晶の結晶構造 及び組成比 x を決定した。 作成した結晶の組成 比 x の評価は, まず作成した結晶についての X線回折の結果から格子定数を決定し, つぎに, 格子定数と組成比の 関係をあらわす Vegard の 法則に

よりxを決定する方法を用いた。 これより焼結体の組成比yに対する作成した $\operatorname{ZnS}_x\operatorname{Se}_{I-x}$ の結晶の組成比xの関係をもとめることが出来る。

作成した 組成比 x=0 の  $\operatorname{ZnS}_x\operatorname{Se}_{1-x}$  (以下  $\operatorname{ZnSe}$ と略す) 結晶に  $\operatorname{Zn}$  過剰の欠陥を導入するため、 $\operatorname{Zn}$  蒸気中,約 1000° で 0.5 時間熱処理を行なった。 また、 $\operatorname{ZnSe}$  結晶に  $\operatorname{Se}$  過剰の欠陥を導入 するため、  $\operatorname{Se}$  蒸気中約 900° C で 3 時間熱処理を行なった。

次に、作成した ZnSe 及び熱処理した ZnSe について、 $400 \sim 700$ nm の波長領域と $25 \sim 300$ °K の温度領域で PL スペクトルを測定した。 未処理の ZnSe における PL の測定は、作成した結晶に含まれる不純物についての情報を得るために、熱処理した ZnSe では、熱処理によって光学的に活性化される不純物等についての情報を得るために行なった。励起光源として超高圧水銀灯を用い、すべてのPLスペクトルは、検出器の波長感度で補正されている。

#### 3. 実験結果と考察

### 3.1 作成した結晶の大きさ,結晶構造,組成比

種々の組成比 y を 持つ焼結体  $\operatorname{ZnS}_y\operatorname{Se}_{I-y}$  を 用 いて,結晶を作成した。その結果を表 1 に示す。表 1 からわかるように焼結体の組成比 y=0 の  $\operatorname{ZnSe}$  を除き大きな単結晶は,得られなかった。

作成した結晶 の 結晶構造は、X線回折 の 実験より、cubic であることが 確かめられた。 また、作成した結晶の組成比xは、X線回折実験より決定された。組成比x=0、0.2、0.83、0.98 の結晶が 得られた。 Fig. 2 に、焼結体の組成比yに対する作成した結晶の組成比xの関係を示した。

作成した  $\mathbf{ZnS}_x$   $\mathbf{Se}_{I-x}$  結晶において大きな単結晶が得られなかった理由としては、結晶成長条件一たとえば引張り速度、電気炉の最高温度あるいは、アンプルの形状など一が、最適条件でなかったことによると考えられる。今後、種々の成長条件を用いて実験を行ない、より大きな  $\mathbf{ZnS}_x$   $\mathbf{Se}_{I-x}$  の単結晶を得るための最適条件を明らかにする必要があると思われる。

次に、焼結体と作成した結晶の組成の関係を理論的に考える。E. T. Handelman  $\mathfrak{S}^9$  が  $\mathrm{CdS}_x$   $\mathrm{Se}_{I-x}$  結 晶 に用いた方法を参考にして考察すると、混晶の組成比 x は、次式であたえられる。

Sample Composition of charge	ZnSe	$ZnS_{0.5}Se_{0.5}$	ZnS <sub>0.8</sub> Se <sub>0.2</sub>	ZnS <sub>0.87</sub> Se <sub>0,13</sub>
of crystal	ZnSe	$ZnS_{0,2}Se_{0.8}$	ZnS <sub>0.83</sub> Se <sub>0.17</sub>	ZnS <sub>0.98</sub> Se <sub>0.02</sub>
Max. Temperature	1050℃	995°C	1100℃	1185℃
Pulling Rate	1 cm/day	0.4 cm/day	Keeping in a temperature gradient	keeping in a temperature gradient
Three Max. Dimensions (mm)	5×3×2	$2\times2\times2$	0.5×0.5×3 (needle)	0.5×0.5×3 (needle)

Table. I.  $ZnS_x Se_{1-x}$  crystals grown by the sublimation method.

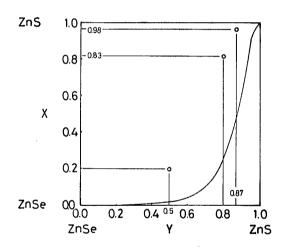


Fig. 2 The relation between compositions, x and y, of the charge and crystal respectively.

Circles are experimental values and the solid line is the calculated value.

$$x = \frac{X_{\text{ZnS}}}{X_{\text{ZnSe}}} = \left(\frac{K_{\text{ZnSe}}}{K_{\text{ZnS}}}\right) \left(\frac{P_{\text{S}_2}}{P_{\text{Se}_2}}\right)^{\frac{1}{2}} \cdots \cdots (1)$$

ただし、 $K_{\rm ZnSe}$  及び  $K_{\rm ZnS}$  は、 それぞれ  ${
m ZnSe}$  及び  ${
m ZnS}$  の平衡定数であり、次式で与えられる。

$$\log K_{\text{ZoSe}} = -36.53 \times 103/T + 18.53 \cdot \cdots \cdot (2)$$

$$\log K_{\text{ZnS}} = -37.13 \times \frac{103}{T} + 18.27 \dots (3)$$

また,  $P_{\mathrm{S}_2}$  及び  $P_{\mathrm{Se}_2}$  は, S 及び Se の分圧をあらわしている。

これらの式を用いて計算した結果を Fig. 2 の 実線で示す。Fig. 2 から実験結果は、計算した結果と大きく 異 なっていること がわかる。 この 理由 の 1 つとして (1) 式において、ZnS と ZnSe の反応 の 相互作用を 考慮しなかったことなどが考えられる。しかし、このく い違いの理由として、何が本質的なものであるか明らかではない。

以上,まとめると,昇華法により, ${\rm ZnS}_x \ {\rm Se}_{I-x}$  の結晶を作成した。作成した単結晶の大きさは, ${\rm ZnSe}$  の場合を除き,光学的測定には不十分である。結晶構造は, ${\rm cubic}$  であり,組成比 x=0 ,0.2,0.83,0.98 を持つ結晶が得られた。 焼結体の組成比 y に対する作成した結晶の組成比 x の関係は,実験と理論において異なるけれども,焼結体の組成比 y によって成長結晶の組成比 x を制御することが出来ることが明らかになった。

## 3.2 フォトルミネッセンス スペクトル

3.2.1 未処理の ZnSe のフォトルミネッセンス スペクトル

Fig. 3 に、未処理の ZnSe の 25°K における PL スペクトルを示す。  $2.8eV \sim 2.65eV$  のエネルギー領域には、鋭いラインを観測し、 2.6eV 以下のエネルギー領域には、1.98eV をピークとする。半値幅 0.21eV の幅広い発光帯を観測した。Fig. 4 に、1.98eV をピークに持つ発光帯(以下、1.98eV 発光帯と略す)の温度依存性を示す。図より温度上昇とともに、1.98eV 発光帯の発光強度は、減少し、その半値幅は、広がることがわかる。さらに、この発光帯のピークエネルギーは、温

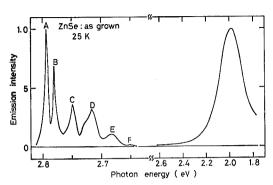


Fig. 3. Photoluminescence spectra in the asgrown ZnSe at 25 °K.

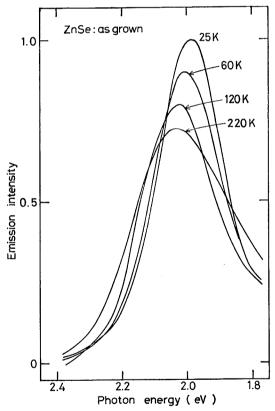


Fig. 4. Temperature dependence of the 1.98 eV emission band in the as-grown ZnSe.

度上昇とともに,高エネルギー側にシフトしていること がわかる。

まず、 $2.8 \text{eV} \sim 2.65 \text{eV}$  の領域にある鋭いラインA,B,C,D,E,Fに注目する。これらのラインのピー

ク位置を既に報告されている 結果 と 比較 することにより、これらのラインは、それぞれ次のように割りあてられる。 A は、 浅い中性アクセプター(主に Zn 位置は置換された Li あるいは、Na) に束縛された励起子による発光、 B は、深いアクセプターとなる Zn の空孔に束縛された励起子による発光、Cは、Bラインの1L Oフォノンサイドバンド、EとFは、浅いドナー・アクセプターペア再結合発光を示していると考えられ、Dについては、明らかではない。

未処理の ZnSe で生じる1.98eV 発光帯の ピーク・エ ネルギーと半値幅は、Iida<sup>10)</sup> によって報告 されている ZnSe のSA発光帯のピークエネルギーと半値幅に一致 している。さらに、1.98eV 発光帯とピーク・エネルギ -の温度依存性-温度上昇とともに,発光帯のピークエ ネルギーは, 高エネルギー側にシフトすること一は, ZnSe の SA 発光帯の温度依存性とよく一致してい る。以上の事より、我々が未処理の ZnSe で観測した 1.98eV 発光帯は、SA発光であると考えられる。SA 発光は、WIbあるいは、IIIb族の不純物と Zn の空孔と の複合中心の励起状態から基底状態への電子の遷移によ り生じると考えられている。したがって、Se原子と置換 するWIb族の不純物一たとえば、Cl、I, Br など一あ るいは、Zn 原子と置換するⅢb族の不純物一たとへば Al, Ga など一が、未処理のZnSe 結晶中に含まれてい ることを示している。

さらに、この発光帯について、より詳しく解析する。 Fig. 5 に、未処理の ZnSe で生じる 1.98eV 発光帯の

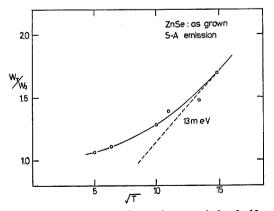


Fig. 5. Temperature dependence of the half-width of 1.98 eV emission band in the as-grown ZnSe.

Circles are experimental values and the solid line is the calculated value.

半値幅の温度依存性を示す。簡単な配座標モデルを用いると半値幅の温度依存性は、次式で与えられる。

$$W_T^2 = W_0^2 \coth\left(\frac{h\nu}{2kT}\right)$$
 .....(4

ただし、 $W_T$  と $W_0$  は、それぞれ絶対温度  $T^\circ$  K と  $0^\circ$  K における半値幅、 $h_V$  は、発光 中心の基底状態の振動エネルギー、 $h_V$  は、ボルツマン定数をあらわしている。

実験結果によく合うように パラメーター  $W_0$  及び  $h\nu$  を決定すると、 $W_0=0.092 {\rm eV}$ 、 $h\nu=0.013 {\rm eV}$  となる。 これらの値を用いて計算した結果を Fig. 5 の実線で示す。さらに励起状態の振動エネルギーが同じであると仮定することにより、次式が与えられる。

$$E_a - E_e = 2 Shv$$
 .....(5)

さらに発光帯が、 ガウス分布であることを仮定すると

$$S \bullet h\nu = \frac{W_{\theta}}{8\ln 2} \qquad \dots (6)$$

ただし、S は、Huang—Rhys 因子をあらわし、電子の 遷移にともない 励 起されるフォノンの数を示す。 $E_a$  と  $E_a$  は 0 フォノン状 態からの吸収と発光のエネルギーをあらわす。(5)と(6)式を用いて S=39、ストークス・シフト・エネルギー $2Sh\nu=1.01\mathrm{eV}$  及び  $E_a=2.99\mathrm{eV}$  の値を得る。

以上をまとめると、 未処理の ZnSe で生じる 発光帯は SA発光であり、結晶中 III b あるいは、 III b あるいは、 III b が含まれていることを示している。さらに、(5)、(6)式から hv=13meV、S=39 の値を得ることができた。

3.2.2. 熱処理した ZnSe のフォトルミネッセンススペクトル

Fig. 6 に Zn 処理し ZnSe の  $25^\circ$  K における P L スペクトルを示す。  $2.6 \mathrm{eV}$  以上のエネルギー 領域には、未処理の ZnSe の場合と同様に鋭いラインA′~G′を観測した。B′~ F′のラインのピーク位置は、未処理の ZnSe の B~F ラインと一致している。また、新しく、A′とG′のラインを観測した。また、 $2.6 \mathrm{eV}$  以下では、2つの幅広い発光帯を観測した。2つの発光帯は、 $25^\circ$ K でそれぞれ  $2.34 \mathrm{eV}$  と  $1.96 \mathrm{eV}$  にピークを持っている。(以後、これらの発光帯を  $2.34 \mathrm{eV}$  発光帯の温度依存性を示す。また、Fig. 8 に  $2.34 \mathrm{eV}$  と  $1.96 \mathrm{eV}$  発光帯の温度依存性を示す。また、Fig. 8 に  $2.34 \mathrm{eV}$  と  $1.96 \mathrm{eV}$  発光帯のピーク・シフト・エネルギーの温度依

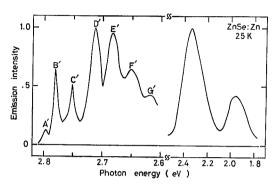


Fig. 6. Photoluminescene spectra in the Zntreated ZnSe at 25 K.

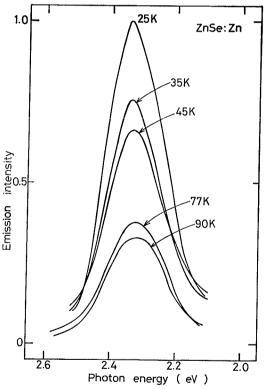


Fig. 7. Temperature dependence of 2.34 eV emission band in the Zn-treated ZnSe.

存性及び 2.34eV 発光帯の半値幅の温度依存性を示す。 これより, 2.34eV 発光帯の発光強度は, 温度上昇とと もに減少し, そのピークエネルギーは, 低エネルギー側 にシフトする。 また 1.96eV 発光帯 のピークエネルギ ーもまた, 温度上昇とともに低エネルギー側にシフトす

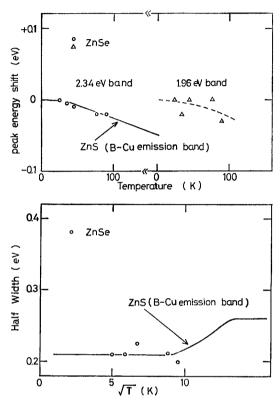


Fig. 8. Temperature dependence of energy shifts and half-width of emission bands in the Zn-treated ZnSe.

- (a) Circles and trigonals represent temperature dependence of peak energy shifts of 2.34 eV and 1.96 eV emission bands respectively.
- (b) Circles represent temperature dependences of the half-width of 2.34 eV emission band.

る傾向にあることがわかる。また、別の実験において、 $1.96 \mathrm{eV}$  発光帯のピークエネルギーの 励起強度依存性を調べると、励起強度が減少するにつれて、その発光帯のピーク 位置 が 低エネルギー側にシフトすることがわかる。

B', C', E', F' ラインは、ピーク位置が、B, C, E, Fラインと一致していることから、B, C, D, F ラインに対応する発光であると考えられる。また、G' ラインは、Eラインと同様、浅いドナーアクセプターペア再結合発光のフォノンレプリカ、A' ラインは、そのピーク位置を既に報告されている結果と比較することにより、中性ドナーに束縛された励起子による発光であると

考えられる。

B. J. Bryant<sup>8)</sup> らは、ZnS の Cu-B 発光と等価な発 光帯を報告している。この発光帯のピーク位置及び半値 幅は, 観測した 2.34eV 発光帯のそれらとよく一致し ている。このことは、2.34eV 発光帯は、7nS の Cu-B 発光と等価な発光帯であることを示している。この発光 は、Cuza (Zn位置に置換した Cu)と In Cu (格子間原子 位置のCu)の複合中心における励起状態から基底状態へ の遷移によると考えられている。また B. J. Bryant ら は,ZnSのCu-G発光と等価な発光帯も報告しているが, この発光帯のピーク位置と半値幅は, 1.96eV 発光帯 のそれと一致している。故に 1.96eV 発光帯は、ZnSの Cu-B と等価な発光帯であることを示している。この発光 は、不純物によるドナーにトラップされた電子と Cu20の アクセプターにトラップされたホールの再結合による発 光であると考えられている。また、1.96eV 発光帯の励 起強度依存性の結果は、1.96eV 発光帯が ZnS の Cu-G発光と等価な発光帯であるという結論と矛盾しない。

2つの発光帯の発光メカニズムに関与する Cu について, Zn 処理中, 結晶中に混入したか, あるいは, 未処理の結晶中 に存在し Zn 処理によって 光学的に活性化されたなどの理由が考えられるが, 現在のところ明らかではない。

また、Se 処理した ZnSe の PL スペクトルは、測定したが 400~700nm の波長領域では、発光を観測することが出来なかった。これらの理由として、Se 処理によって、ルミネッセンス、キラーとなる不純物が混入したか、 あるいは、Se 処理によって導入された欠陥中心において非輻射遷移が優勢であるなど考えられるが、明らかではない。

以上、 まとめると Zn 処理した ZnSe において2つの発光帯が生じた。これらの発光帯は、それぞれ ZnS の Cu-B と Cu-G 発光に等価な発光帯であった。これより、結晶中に、ドナーとなる不純物と Cu が含まれていることが明らかにされたが、処理中に混入したのか、あるいは、処理によって光学的に活性化されたのか、明らかではない。また Se 処理した ZnSe では発光は観測されなかった。

### 4. ま と め

昇華法の一種である modified Piper 法を用いて組成 比 x=0, 0.2, 0.83, 0.98 o  $\operatorname{ZnS}_x\operatorname{Se}_{I-x}$  o 結晶を 作成した。ZnS 及び ZnSe の結晶構造は、cubic であった。焼結体の組成比 y に対する作成した 結晶の組成比 x の関係は、実験と理論で異なるが、焼結体の組成比 yによって成長結晶の組成比 x を制御することが出来ることが明らかになった。

また、未処理の ZnSe では、SA 発光が生じ作成した結晶中に WI b あるいは III b 族元素が含まれていることが明らかになった。Zn 処理した ZnSe では、ZnS の Cu-B と Cu-G 発光と等価な2つの発光が生じた。これより Zn 処理した ZnSe 結晶に Cu やドナーとなる不純物が含まれていることが明らかとなった。しかし、これらの不純物が、作成した結晶中に存在し、処理によって光学的に活性化されたのか、あるいは、Zn 処理中に混入したのか、現在のところ明らかではない。Se 処理した ZnSe では、発光は、観測されなかった。

#### 参 考 文 献

- 1) J. Schneider, L. Leutwein and A. Räuber; Solid State Commun. 5 (1967) 779.
- 2) Y. Schno and T. Yoshida; Annual Report of

- the Radiation Center of Osaka, Prefucture, 10 (1974) 51.
- K. Matsuura, I. Tsurumi, and F. Takeda;
   phys. stat. sol. (a) 28 (1975) 379.
- 4) K. Matsuura, S. Teratani, S. Kishida and I. Tsurumi; Inst. Phys. Conf. Ser. No. 31 (1977) 418.
- G.D. Watkins; Radiation Effects in Semiconductors, ed J. W. Corbett and G.D. Watkins, p 301, 1971.
- 6) G.D.Watkins; Inst. Phys. Conf. Ser. No. 31 (1977) 95.
- 7) F. Morehead; J. Phys. Chem. Solids, 24 (1963) 37.
- F. J. Bryant and P. S. Manning; J. Phys. Chem. Solids, 35 (1974) 97.
- E. T. Handelman and W. Kaiser; J. Appl. Phys. 35 (1964) 3519.
- 10) S. Iida; J. Phys. Soc. Japan, 25 (1968) 177.